

MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE

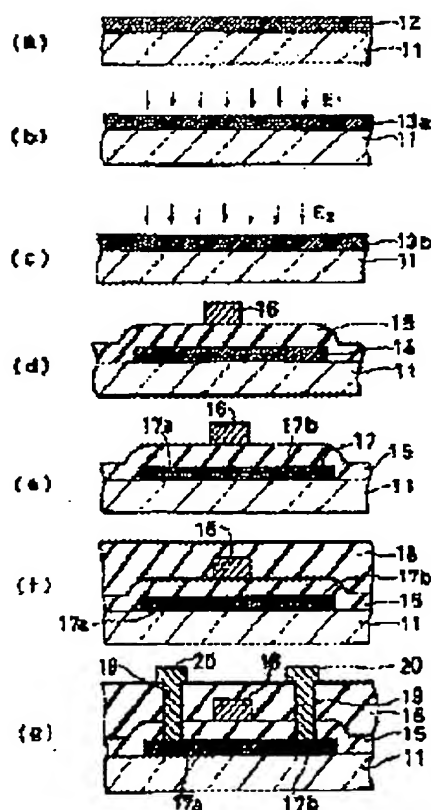
Patent number: JP6077131
 Publication date: 1994-03-18
 Inventor: ASAI ICHIRO; KATO SUKEJI
 Applicant: FUJI XEROX CO LTD
 Classification:
 - international: H01L21/20; H01L21/268; H01L21/02; (IPC1-7): H01L21/20; H01L21/268
 - european:
 Application number: JP19920248642 19920825
 Priority number(s): JP19920248642 19920825

Report a data error here

Abstract of JP6077131

PURPOSE: To reduce a variation of characteristics in a substrate while maintaining a high field-effect mobility by illumination with laser light having an energy density higher than a threshold energy density for phase transition from an amorphous semiconductor to a polycrystalline semiconductor.

CONSTITUTION: An amorphous silicon layer 12 is deposited on an insulating substrate 11. A poly-Si layer 13a is formed by illuminating the amorphous silicon layer 12 with excimer laser light having an energy density E1 higher than a threshold energy density for the phase transition. Then, another poly-Si layer 13b is formed by illumination with laser light having a further higher energy density E2. After an operation layer 14 is formed by patterning the poly-Si layer 13b, a gate insulating film 15 is formed by depositing SiO₂. Then, a gate electrode 16 is formed at a central portion. After a source region 17a and a drain region 17b are formed, an interlayer insulating film 18 is formed by depositing SiO₂. Next, contact holes 19 are opened, and a wiring 20 is formed by depositing and patterning Aluminum.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(9) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平6-77131

(13) 公開日 平成6年(1994)3月18日

(51) Int. Cl.

識別記号

F I

H01L 21/20

9171-4M

21/268

Z 3617-4M

審査請求 未請求 請求項の数 7 (全 7 頁)

(21) 出願番号 特願平4-248642

(71) 出願人 000005496

富士ゼロックス株式会社

東京都港区赤坂三丁目3番6号

(22) 出願日 平成4年(1992)8月25日

(72) 発明者 浅井 市郎

神奈川県海老名市本郷2274番地 富士ゼロ

ックス株式会社海老名事業所内

(72) 発明者 加藤 典司

神奈川県海老名市本郷2274番地 富士ゼロ

ックス株式会社海老名事業所内

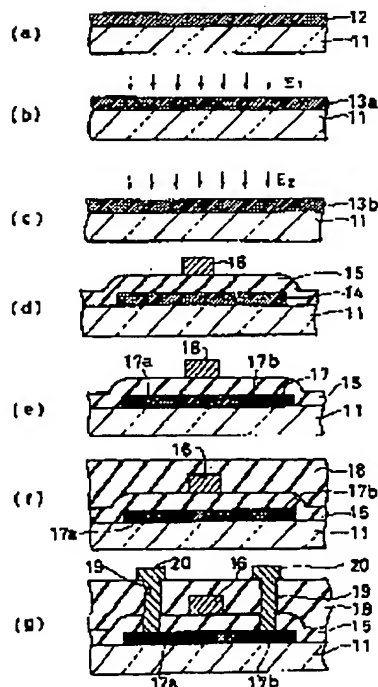
(74) 代理人 弁理士 阪本 清孝 (外1名)

(34) 【発明の名称】 半導体素子の製造方法

(37) 【要約】

【目的】 非晶質半導体層をアニールして多結晶半導体層を形成する半導体素子の製造方法において、半導体素子の特性の向上及び均一性を図る。

【構成】 非晶質半導体（アモルファスシリコン）から多結晶半導体（多結晶シリコン）に相転移するに必要なしきい値エネルギー密度 E_1 より大きいエネルギー密度 E_2 のレーザー光を照射することにより、非晶質半導体層をアニールして該過程中に1000オングストローム以下の多数の微小結晶核を形成し、前記エネルギー密度 E_2 より大きいエネルギー密度 E_3 のレーザー光を照射することにより、前記結晶核内外の欠陥を溶解させ、前記結晶核により粒径を強制的に小さく均一化して、半導体素子の特性の向上及び均一性を図る。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 絶縁基板上に堆積した非晶質半導体層をレーザの照射により結晶化させて多結晶半導体層を得る工程を具備する半導体素子の製造方法において、前記非晶質半導体層をレーザの照射により多結晶化する際に、非晶質半導体から多結晶半導体に相転移するに必要なしきい値エネルギー密度 E_1 より高く、且つ粒径が1000オングストローム以下となる多数の結晶核が形成されるエネルギー密度 E_2 で非晶質半導体層をアニールする第1の工程と、前記エネルギー密度 E_2 より高いエネルギー密度 E_3 で前記結晶核が形成された多結晶半導体層を再度アニールし第1の工程で準備された結晶核内外の欠陥を溶融する第2の工程とを有し、前記エネルギー密度 E_3 は第1の工程で形成された全ての結晶核を完全に再溶融する大きさより小さいことを特徴とする半導体素子の製造方法。

【請求項 2】 絶縁基板上に堆積したアモルファスシリコン層をエキシマレーザの照射により結晶化させて多結晶シリコン層を得る工程を具備する半導体素子の製造方法において、前記アモルファスシリコン層をレーザの照射により多結晶化する際に、アモルファスシリコンから多結晶シリコンに相転移するに必要なしきい値エネルギー密度 E_1 より大きいエネルギー密度 E_2 でアモルファスシリコン層をアニールし、粒径が1000オングストローム以上10000オングストローム以下となる結晶核を形成する第1の工程と、前記エネルギー密度 E_2 より大きく且つ第1の工程で形成された全ての結晶核を完全に再溶融する大きさより小さいエネルギー密度 E_3 で結晶核が準備された多結晶シリコン層を再度アニールし、前記結晶核内外の欠陥を溶融する第2の工程と、を有することを特徴とする半導体素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、薄膜プロセスで積層形成される半導体素子の製造方法に係り、特に、大面積上に堆積された非晶質半導体層上に紫外線を照射させ、アニールすることにより結晶化させて多結晶半導体層を得る際のアニールの方法に関する。

【0002】

【従来の技術】 近年、大型で高解像度の液晶パネルや、高速で高解像度の密着型イメージセンサへの要求が高まるにつれ、大面積の絶縁基板上に薄膜トランジスタ(TFT)を高性能かつ均一に作製することが望まれている。主点温度は低いが安価で大面積化が容易なガラス基板上にTFTを作製する場合、TFTの動電圧となる多結晶シリコン(poly-Si)層を形成する方法として、例えば、ガラス基板上にアモルファスシリコン層を堆積し、このアモルファスシリコン層をパルスレーザであるエキシマレーザでアニールして多結晶シリコンを得る方法が提案されている(Extended Abstracts of the 1991

International Conference on Solid State Devices and Materials, 1991, pp623)。上記方法によれば、紫外線で高エネルギーであるが短いパルス幅(20ns)のエキシマレーザを出射できるエキシマレーザ(例えば、KrFなら発振波長248nm)を用いるため、膜内の欠陥を少なくでき且つ基板に熱ダメージを与えにくいので、熱点の低いガラス基板を絶縁性基板として使用でき且つ高性能なTFTを実現できるという利点がある。

【発明が解決しようとする課題】

【0003】上記方法によると、レーザを照射する際にそのエネルギー密度により多結晶シリコンの粒径が変化するという性質を有する。通常は、多結晶シリコンの粒径を大きくして良好な電界効果移動度 μ を得るため、比較的大きな450mJ/cm²程度のエネルギー密度のレーザで照射が行なわれるが、この場合、多結晶シリコン層の表面平坦性が悪化してTFT特性が十分でなかったり、また、膜における特性のばらつきが生じ易くなるので、シフトレジスタ等の駆動回路の設計や作成に悪影響を及ぼすという問題点があった。また、多結晶シリコン層の表面平坦性を良好とするため、低いエネルギー密度のレーザで照射を行なうと、今度は電界効果移動度 μ が小さくなり特性が良好なTFTを得ることができない。

【0004】本発明は上記実情に鑑みてなされたもので、高い電界効果移動度 μ を維持しつつ特性が基板内でばらつくことが少ない多結晶半導体層の製造方法を提供することを目的としている。

【0005】

【課題を解決するための手段】 上記従来例の問題点を解決するため請求項1の発明は、絶縁基板上に堆積した非晶質半導体層をレーザの照射により結晶化させて多結晶半導体層を得る工程を具備する半導体素子の製造方法において、前記非晶質半導体層をレーザの照射により多結晶化する際に、次のような工程で行なうことを特徴としている。第1の工程として、非晶質半導体から多結晶半導体に相転移するに必要なしきい値エネルギー密度 E_1 より大きく、且つ粒径が1000オングストローム以下となる多数の結晶核が形成されるエネルギー密度 E_2 で非晶質半導体層をアニールする。第2の工程として、前記エネルギー密度 E_2 より大きいエネルギー密度 E_3 で前記結晶核が形成された多結晶半導体層を再度アニールし、第1の工程で準備された結晶核内外の欠陥を溶融する。また、前記エネルギー密度 E_3 は、第1の工程で形成された全ての結晶核を完全に再溶融する大きさより小さくする。

【0006】請求項2の発明は、絶縁基板上に堆積したアモルファスシリコン層をエキシマレーザの照射により結晶化させて多結晶シリコン層を得る工程を具備する半導体素子の製造方法において、前記アモルファスシリコ

3

ン層をレーザーの照射により多結晶化する際に、次のような工程で行なうことを特徴としている。第1の工程として、アモルファスシリコンから多結晶シリコンに相転移するに必要なしきい値エネルギー密度 E_1 より大きいエネルギー密度 E_2 でアモルファスシリコン層をアニールし、粒径が1000オングストローム以上10000オングストローム以下となる結晶核を形成する。第2の工程として、前記エネルギー密度 E_1 より大きく且つ第1の工程で形成された全ての結晶核を完全に再溶解する大きさより小さいエネルギー密度 E_3 で結晶核が準備された多結晶シリコン層を再度アニールし、前記結晶核内外の欠陥を消滅する。

【0007】

【作用】本発明によれば、非晶質半導体（アモルファスシリコン）から多結晶半導体（多結晶シリコン）に相転移するに必要なしきい値エネルギー密度 E_1 より大きいエネルギー密度 E_2 のレーザー光を照射することにより、非晶質半導体層をアニールして該層中に1000オングストローム以下の多数の微小結晶核を形成する。

【0008】前記工程で作製された多結晶半導体層（poly-Si層）には、結晶核内部及び境界において欠陥が多く存在する。そして、前記エネルギー密度 E_1 より大きいエネルギー密度 E_2 のレーザー光を照射することにより、前記結晶核内外の欠陥を消滅する。この時、エネルギー密度 E_2 を、第1の工程で形成された全ての結晶核を完全に再溶解する大きさより小さくしたので、第1の工程で形成された結晶核自体はほとんど溶けず、この核が律速因子となり粒径が強制的に小さく均一化される。

【0009】

【実施例】本発明の実施例について図1及び図2を参照しながら説明する。ガラス等の絶縁性基板11上にLPCVD法等により1000オングストローム程度の膜厚のアモルファスシリコン（a-Si）層12を堆積し（図1（a））、a-Siからpoly-Siに相転移するために必要なしきい値エネルギー密度 E_1 より大きいエネルギー密度 E_2 を有するエキシマレーザーを照射することによりa-Siのアニールを行ない、多数の結晶核を有するpoly-Si層13aを形成する（図1（b））。続いて、エネルギー密度 E_2 より大きいエネルギー密度 E_3 を有するエキシマレーザーを照射し、エネルギー密度 E_3 のエキシマレーザーを照射することにより形成された前記結晶核内外の欠陥を溶解除去し、結晶性が良好なpoly-Si層13bを形成する（図1（c））。この時、エネルギー密度 E_3 を、前記工程で形成された全ての結晶核を完全に再溶解する大きさより小さく設定することにより、前記工程で形成された結晶核は溶けず、この核の粒径によりpoly-Siの粒径が決まるので強制的に小さく均一化させることができる。エキシマレーザーは、KrF（248nm発振）で、パルス幅20ns、ビームの大きさは7×7mm²、ビーム内のエネルギー均一性は

4

±5%以下のものを使用した。また、この場合のしきい値エネルギー密度 E_1 は170mJ/cm²であった。

【0010】次に、前記poly-Si層をフォトリソ法により島状にパターニングして動作層14を形成し、続いてLPCVD法により1000オングストロームのSiO₂を全面に堆積してゲート絶縁膜15を形成する。そして、前記動作層14の略中央部に対応するゲート絶縁膜15上にLPCVD法により3000オングストロームのpoly-Siを堆積し、パターニングしてゲート電極16を形成する（図1（d））。ゲート電極16をマスクとしてイオンを注入によりドーパントを注入し、ソース部17a及びドレイン部17bを形成し（図1（e））、LPCVD法により7000オングストロームの膜厚のSiO₂を堆積して層間絶縁膜18を形成する（図1（f））。

イオン注入する際、nチャネルTFTとしての部分にはリン（P）を、pチャネルTFTとしての部分にはホウ素（B）を注入した。次に層間絶縁膜18をパターニングして前記ソース部17a及びドレイン部17bに対応する位置にコンタクト孔19を開けし、水素化処理を350℃にて行なった後、Alを堆積及びパターニングして配線20を形成し、薄膜トランジスタを作製する（図1（g））。

【0011】次に、上記TFTの製造方法において、特性が良好であり且つ均一化が図れるTFTを得るためのエネルギー密度 E_1 及びエネルギー密度 E_2 についての検討を行なった。上記方法により得られたnチャネルTFT及びpチャネルTFTの移動度のバラツキについて、エネルギー密度 E_2 を450mJ/cm²に固定したときのエネルギー密度 E_1 依存性について測定したグラフを図2に示す。図2におけるエネルギー密度 E_1 は0mJ/cm²が従来例に相当するものである（単一のエネルギー密度 E_2 でアニールを行なう）。上記実施例の場合、しきい値エネルギー密度 E_{th} は約170mJ/cm²であるが、エネルギー密度 E_1 が270mJ/cm²を越える付近から急激に移動度が均一化し、従来にない均一性が得られることが確認できる。

【0012】次に、nチャネルTFT及びpチャネルTFTの移動度のバラツキについて、エネルギー密度 E_2 を270mJ/cm²に固定したときのエネルギー密度 E_1 依存性について測定したグラフを図3に示す。このグラフによると、エネルギー密度 E_1 の増加とともに移動度の特性は向上するが、エネルギー密度 E_1 が520mJ/cm²のように大きすぎると均一性が悪化する。従って、エネルギー密度 E_1 としては、400～500mJ/cm²程度が適当であることが解る。

【0013】上記実施例では、エネルギー密度 E_1 による第1のアニールで多数の結晶核を形成し、エネルギー密度 E_2 より大きいエネルギー密度 E_3 により第2のアニールを行ない、前記結晶核内外の欠陥を除去する。第2のアニールで消滅しない程度の核とするためには、第1

のアニールにおいて、核の大きさを100オングストローム以上とする必要がある。小さすぎる核を保持するためには、より低いエネルギー密度 E_1 を使用することも考えられるが、その場合、膜中欠陥が溶融除去されずに良好なTFT特性を得ることができない。また、核が大きすぎると膜の表面平坦性が劣化し、しきい値電圧等のTFT特性を悪化させるので、核の大きさは1000オングストローム以下である必要がある。また、エネルギー密度 E_1 が大きすぎると核の大小によらず全ての核を完全溶融し、 $E_1=0$ の従来と同じく不均一な膜質となってしまう。エネルギー密度 E_1 が520mJ/cm²以上であると上記現象が生じる。

【0014】表面平坦性は第1のアニールのエネルギー密度 E_1 に大きく依存するので、エネルギー密度 E_1 を450mJ/cm²に固定し、表面平坦性のエネルギー密度 E_1 依存性について原子間力顕微鏡で測定した。その結果を図4に示す。表面平坦性は、アニールされたpoly-Si層の最も低い位置を基準面とし、この基準面との高低差により定義した。測定においては、アニールされたpoly-Si層において、任意に選択した2 μ m \times 2 μ mの面積部分(3つ若しくは4つの位置)での前記基準面との高低差を各エネルギー密度 E_1 毎に2万点程度測定し、その平均値を図4に表示したものである。図ではエネルギー密度 $E_1=0$ が従来法に相当する。 $E_1=0$ あるいは E_1 が小さい場合は、 E_1 で生じる核が小さすぎてFET照射時に消滅してしまい、ステップ的にアニールする効果が現れない。また、エネルギー密度 E_1 が大きすぎると、次に述べる図5の関係から最終的な膜の平坦性が

劣化してしまうので適当でない。図4より、各測定点での表面平坦性が均一となるエネルギー密度 E_1 は、240~380mJ/cm²程度であり、表面平坦性が低い値を示し且つ均一性に優れるのはエネルギー密度 E_1 が270mJ/cm²であることが確認できた。なお、別の実験からエネルギー密度 E_1 が270mJ/cm²の条件において、平坦性のみならず粒径も最も均一になっていることがわかった。エキシマレーザーのエネルギー密度の変化に対する核(グレイン)の大きさは図5のようになるので、エネルギー密度 E_1 は270mJ/cm²に対応するグレインサイズは200オングストロームとなり、この粒径を有する多結晶シリコン層を有するTFTが良好な特性を有し、且つ特性の均一化を図ることができると考えられる。また、第2のアニールのエネルギー密度 E_2 は、第1のアニールで形成された結晶核を完全に再溶融してしまう大きさより小さくする必要がある。第1のアニールのエネルギー密度 E_1 を270mJ/cm²とした場合、エネルギー密度 E_2 は450mJ/cm²程度となる。

【0015】以上のことから上記実施例における最適なエネルギー密度 E_1 及びエネルギー密度 E_2 として、 $E_1=270$ mJ/cm²、 $E_2=450$ mJ/cm²を選択し、nチャネルTFT及びpチャネルTFTの作製を行ったところ、特性の均一化が図れるとともに、移動度 μ 、しきい値電圧 V_{TH} 、最小リーク電流 I_{MIN} として次のような良好な値を得ることができた(TFTのサイズは、ゲート幅/ゲート長=50 μ m/10 μ mである)。

	nチャネルTFT	pチャネルTFT
移動度 μ (cm ² /V \cdot S)	57	45
しきい値電圧 V_{TH} (V)	0.8	-2.7
最小リーク電流 I_{MIN} (pA)	8	-2

【0016】ここで、移動度が均一化した場合のpoly-Si膜の粒径を透過電子顕微鏡で評価したところ、平均粒径は従来の約50%に減少していたが、基板内の分布をみるときわめて粒径が均一化していることが確認できた。従って、上記実施例のように異なるエネルギー密度によりステップ的にアニールを行なう場合、粒径の均一化により移動度が均一化することがわかる。

【0017】次に、本実施例方法による粒径の均一化の原理について説明する。最初のアニールの際に照射されるレーザーのエネルギー密度 E_1 は、しきい値エネルギー E_0 より大きいもののa-Siを完全に多結晶化させるには相対的には小さいため、アニール後の膜中には多数の微小な結晶性の核が生じるとともに、アモルフォースに近い欠陥が多数残存する。この状態において、大きなエネルギー密度 E_2 のレーザーを照射すると、膜内の欠陥は溶融除去されるが準備された多数の結晶核は溶けないので、この核により粒径が強制的に小さく均一化される。このとき、エネルギー密度 E_2 を大きくすると(上

記実施例では520mJ/cm²以上)、準備した結晶核までも完全に再溶融してしまうので、従来の単一エネルギー密度のみを用いたアニールと同じ結果になる。

【0018】すなわち、アニールは、図6(a)に示すように、レーザービーム61を基板上で移動させて行なうが、まんべんなく照射させるため1回のビームの移動の長さLの1割程度をオーバーラップさせて照射を行なう。そのため、ビーム端のエネルギー減少部の影響やビーム内のエネルギーばらつき及び膜内に生じる温度勾配や温度ゆらぎがそのままpoly-Si膜の粒径に反映し、図7に示すように平均粒径は1500オングストロームと大きいグレインの粒径にばらつきを生じさせる(特に、オーバーラップ領域で他の部分に比較してグレイン径が端部に小さくなる)。これに対して異なるエネルギー密度によりステップ的にアニールを行なう場合、図6(b)に示すように、既にエネルギー密度 E_1 (270mJ/cm²)でアニールされた部分を再度エネルギー密度 E_2 (450mJ/cm²)でアニールする。そのた

め、グレイン径はエネルギー密度が小さい1回のアニールで決定されるので粒径は800オングストロームと小さくなるものの、2回のアニールの間にビーム内のエネルギー密度のばらつきや温度ばらつきによるグレイン径のばらつきへの影響を受けることを防ぐ(図7に示すように、特にオーバーラップ領域におけるグレイン径の落ち込み幅が小さくなる)。以上から、エネルギー密度E₁は適当な大きさの核を準備して粒径や平坦性を均一化する役割を、エネルギー密度E₂は残存する欠陥を除去する役割をそれぞれ担っているといえる。

【0019】また、270mJ/cm²のエネルギー密度で単独アニールを行なった場合、270mJ/cm²及び450J/cm²のエネルギー密度で2回アニールを行なった場合、450mJ/cm²のエネルギー密度で単独アニールを行なった場合のそれぞれについて、表面平坦性における分布について測定した結果を図8に示す。横軸の表面平坦性は、図4と同様に、アニールされたpoly-Si層の最も低い位置を基準面とし、この基準面との高低差とした。また、測定においては、2μm×2μmの面積部分(例えば3つ若しくは4つの位置)での前記基準面との高低差を各面積について2点程度測定し、その数を分母として0~100(nm)の各高低差(表面平坦性)が占める割合を縦軸にとって表示したものである。図より、450mJ/cm²のエネルギー密度で単独アニールを行なった場合に比較して、270mJ/cm²及び450J/cm²のエネルギー密度で2回アニールを行なう場合の方が、高低差(表面平坦性)の分布の広がり幅が小さくなるとともに、高低差(表面平坦性)の平均値も図の左側にシフトしてその値を小さくし、表面平坦性の均一化が図れることを確認することができた。なお、270mJ/cm²のエネルギー密度で単独アニールを行なった場合、平坦性は良好であるが膜内の欠陥が多数存在するためTFTへの適用はできない。

【0020】上記実施例においては、半導体膜としてSiを使用した場合について説明したが、Ge、SiGe、InSb等の半導体膜にも適用することができる。また、レーザーとしては、エキシマレーザーに限らずルビ

ンレーザー等の他のパルスレーザーを用いてもよい。また上記実施例の場合、レーザーアニールにより形成されたpoly-Si層はTFTの動作層として用いられたが、半導体装置やTFTのゲート電極や抵抗体にpoly-Si層を使用した場合、これらの作製の際に本実施例方法を適用してもよい。

【0021】

【発明の効果】本発明方法によれば、非晶質半導体(アモルファスシリコン)から多結晶半導体(多結晶シリコン)に相転移するに必要なしきい値エネルギー密度E₁より大きいエネルギー密度E₂のレーザー光を照射することにより、非晶質半導体膜をアニールして該層中に1000オングストローム以下の多数の微小結晶核を形成し、前記エネルギー密度E₁より大きいエネルギー密度E₂のレーザー光を照射することにより、前記結晶核内外の欠陥を溶解させるので、前記結晶核により粒径が強制的に小さく均一化され、半導体素子の特性の向上及び均一性を図ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 (a)ないし(g)は本発明方法の実施例の製造プロセスを説明する工程図である。

【図2】 実施例方法で得られるTFTの移動度のエネルギー密度E₁依存性を示すグラフ図である。

【図3】 実施例方法で得られるTFTの移動度のエネルギー密度E₂依存性を示すグラフ図である。

【図4】 実施例方法で得られる半導体膜の表面平坦性のエネルギー密度E₁依存性を示すグラフ図である。

【図5】 a-Siを多結晶化させる際のグレインサイズエネルギー密度E₁依存性を示すグラフ図である。

【図6】 (a)及び(b)はレーザービームによるアニールを行なう場合の模式図である。

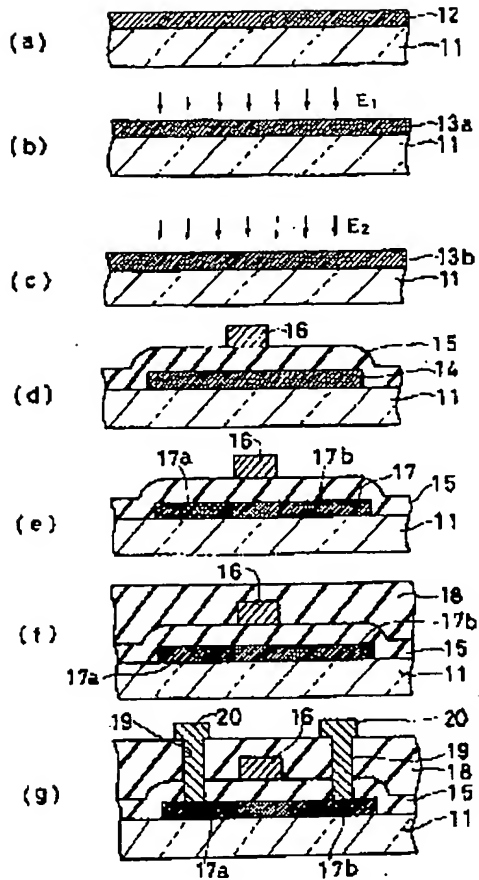
【図7】 アニールを行なう場合のビーム位置とグレインサイズとの関係を示すグラフ図である。

【図8】 アニールに際しての表面平坦性の分布を示すグラフ図である。

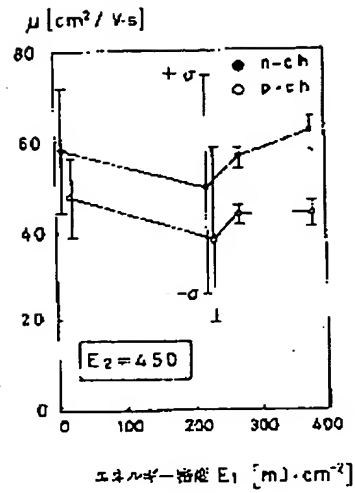
【符号の説明】

11…絶縁性基板、12…アモルファスシリコン膜、13…poly-Si層、14…動作層、15…ゲート絶縁膜、16…ゲート電極、17a…ソース部、17b…ドレイン部、18…周縁絶縁膜、19…コンタクト孔、20…配線

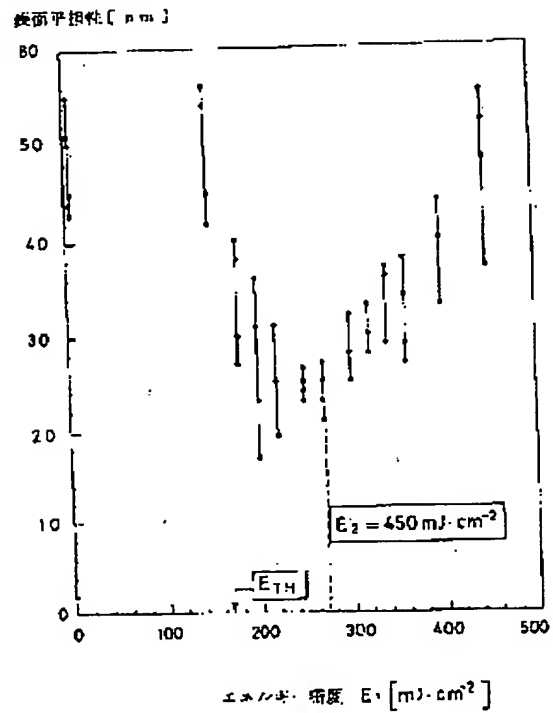
【図1】



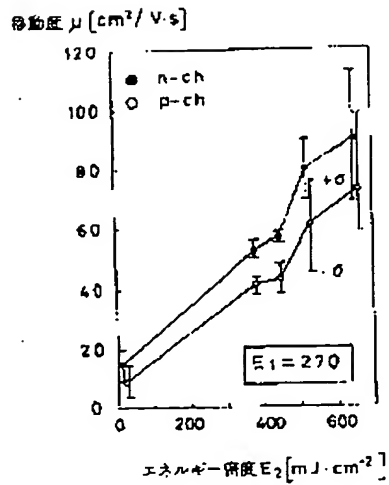
【図2】



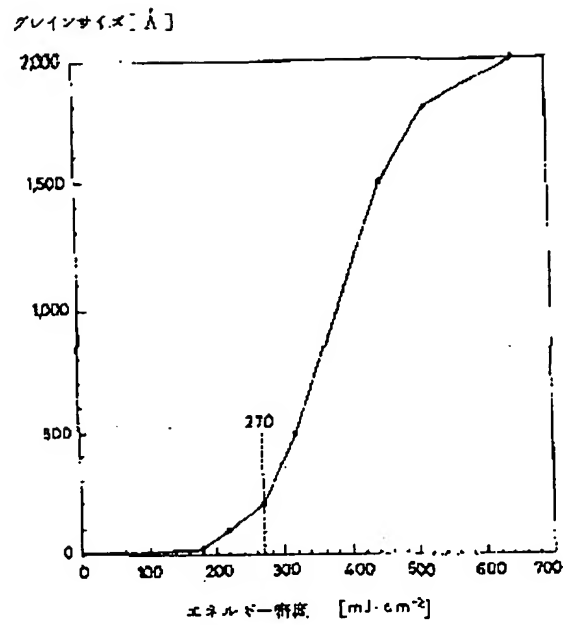
【図3】



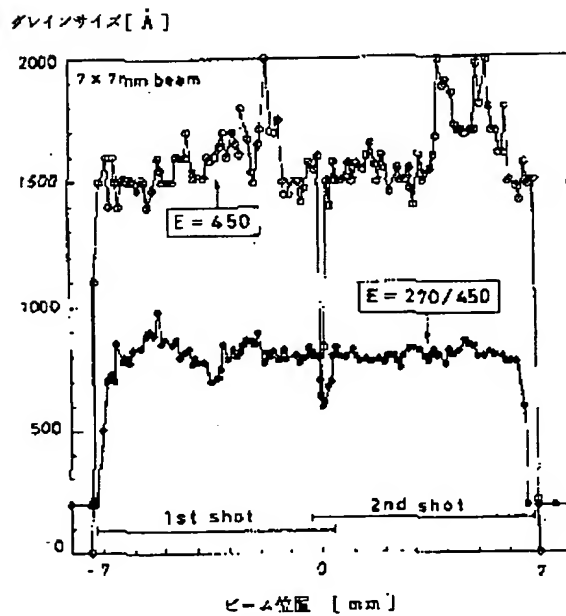
【図3】



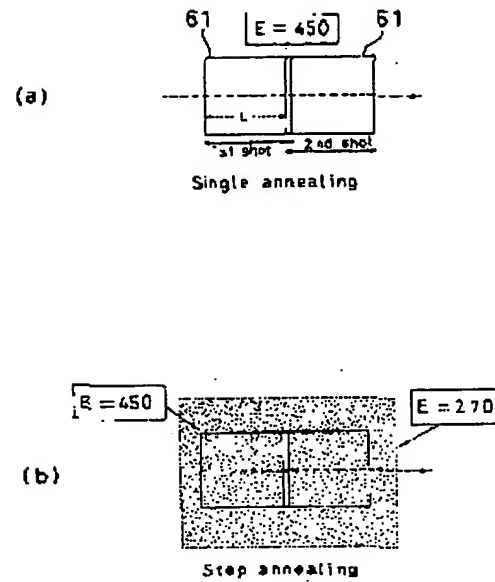
【図5】



【図7】



【図6】



【図8】

割合 [%]

